



Sverige

(12) Patentskrift

(10) SE 530 413 C2

(21) Patentansökningsnummer: 0700177-9  
(45) Patent meddelat: 2008-05-27  
(41) Ansökan allmänt tillgänglig: 2008-05-27  
(22) Patentansökan inkom: 2007-01-25  
(24) Löpdag: 2007-01-25  
(83) Deposition av mikroorganism: ---  
(30) Prioritetsuppgifter: ---

(51) Internationell klass:  
*G01B 7/06* (2006.01)  
*G01B 13/06* (2006.01)

(73) Patenthavare: Daprox AB, Box 120, 127 23 Skärholmen SE  
(72) Uppfinnare: Bengt Åkerblom, Vårby SE  
(74) Ombud: Albihs AB  
(54) Benämning: Anordning för att mäta lagertjocklek samt en metod för att tillverka nämnda anordning  
(56) Anförda publikationer: ---  
(47) Sammandrag:

**Anordning för mätning av tjockleken hos ett lager eller ett belägningslager på ett långsträckt band (10) av material vilket passerar förbi mätanordningen. Anordningen innefattar don för mätning av tjockleken i olika positioner längs det långsträckta bandets (10) bredd. Donet för mätning av tjockleken är placerat i radiell riktning från en longitudinell axel (21) genom en rulle (20) som stödjer det långsträckta bandet (10). Donet för mätning av tjockleken innefattar ett sensorhuvud (12) anordnat att vila på en gaskudde som genereras mellan sensorhuvudet (12) och ytan på det långsträckta bandet (10), och den yttre periferin (25) på rullen (20) är krökt i axiell riktning med en större diameter mot ändarna av rullen (20).**

